

## ★ディペンダブルコンピューティング研究会 (DC)

専門委員長 土屋達弘 副委員長 細川利典

幹事 新井雅之・難波一輝

日時 2月28日(火) 11:00~17:05

会場 機械振興会館

議題 VLSI 設計とテスト及び一般

午前 故障診断・故障解析 (11:00~11:50)

1. GANによるLSI欠陥検出手法の再検討 福本 聡(都立大)
2. 故障診断分解能向上のための複数故障ペア識別パターン生成法  
○千田祐弥・細川利典(日大)・山崎浩二(明大)

午後 ソフトウェアテスト・近似回路設計 (13:00~14:15)

3. 信頼度計算プログラムに対するメタモルフィックテストの適用 ○浅地泰斗・土屋達弘(阪大)
4. A Clear and Understandable Notation for Expressing T-Way Test Sequence Generation Constraints  
○Lele Jiang・Tatsuhiko Tsuchiya(Osaka Univ.)
5. 近似乗算器における誤り補正と信頼度の関係に関する解析  
○高妻珠希・王 麒霖・市原英行・井上智生(広島市大)

テスト容易化設計 (14:25~15:40)

6. グラフニューラルネットワークと深層強化学習による論理回路のテストポイント選択法  
○魏 少奇・塩谷晃平・王 森レイ・甲斐 博・樋上喜信・高橋 寛(愛媛大)
7. 2パターン並列テストのためのコントローラの制御信号のドントケア割当て法  
徐 浩豊・○細川利典(日大)・吉村正義(京都産大)・新井雅之(日大)
8. 組込み自己テストのための複数ランダムパターンレジスタント遷移故障のシード生成法  
徐 雁レイ・三浦 怜・○細川利典(日大)・吉村正義(京都産大)

LSI テスト・回路設計 (15:50~17:05)

9. 入力電圧範囲を制御可能な確率的フラッシュADC ○坂口 平・小松 聡(東京電機大)
10. A Novel High Performance Scan-Test-Aware Hardened Latch with Improved Soft Error Tolerability  
○Ruijun Ma(Anhui Univ. of Sci. and Tech.)・Stefan Holst・Xiaoqing Wen(Kyushu Inst. of Tech.)・Hui Xu(Anhui Univ. of Sci. and Tech.)・Aibin Yan(Anhui Univ.)
11. 論理回路内のホットスポット特定手法とテストパターンごとに異なるホットスポットの評価に関する研究  
○宇都宮大喜・宮瀬紘平(九工大)・ルー シュエクン(台湾科技大)・温 暁青・梶原誠司(九工大)

☆DC 研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

3月23日(木)~25日(土) 天城町防災センター(徳之島) [締切済] テーマ:組込み技術とネットワークに関する  
ワークショップ ETNET2023

### 【問合先】

新井雅之(日大)

E-mail: arai.masayuki@nihon-u.ac.jp

◎最新情報は、DC 研究会ホームページを御覧下さい。

<http://www.ieice.org/iss/dc/jpn/index.html>